

模拟 IC 测试系统-STS8200

产品特点:

- 针对各类模拟、线性、电源管理类、音频类、模拟开关、LED 驱动类模拟及混合信号的测试系统;
- 最高 16/32 工位并行测试能力; 支持乒乓测试模式; TWIN 测试模式; 多站并发测试模式;
- 在 **CROSS** 机柜下可扩展成 MOSFET 测试机或混合信号测试机。
- 提供 13 个插槽的 STS8200B 可选



资源		主要性能指标
浮动源/表	FPVI10 /FPVI10 PLUS	<ul style="list-style-type: none"> 2 通道浮动 V/I, 每通道$\pm 40V/\pm 10A$ 脉冲, 4Kx16Bits AWG, 500KSPS 4Kx16Bits 电压和电流 Digitizer $\pm 100V@200mA$ 直流 (FPVI10 PLUS 版本有此功能)
	FOVI100	<ul style="list-style-type: none"> 8 通道, 每 4 路一组浮动 V/I, 每通道$\pm 40V/\pm 100mA$ 直流, $\pm 1A$ 脉冲, 2Kx16Bits AWG, 100KSPS 2Kx16Bits 电压和电流 Digitizer
	HVI1K	<ul style="list-style-type: none"> 单通道浮动 V/I, 每通道$\pm 1000V/\pm 10mA$, 16-Bit 驱动/测试
	QVM	<ul style="list-style-type: none"> 2 或 4 通道浮动高精度电压表, 每通道$\pm 100V$ 测试范围, 每通道具备 18-Bit 1MSPS 及 12-Bit 10MSPS Digitizer, 每通道存储深度 64K x 18 Bits
时间测量	QTMU PLUS II	<ul style="list-style-type: none"> 2 或 4 通道时间测试单元, 每通道$\pm 25V$ 电压范围, 精度$\pm 2ns \pm 0.1\%$ Rd, 65pS 分辨率
数字通道	DIO2.0 /DIO2.0 PLUS	<ul style="list-style-type: none"> 8 路数字通道, $-2V \sim +7V$ 驱动比较电平, 5MHz 测试频率, 64K 向量深度 1M 向量深度 (DIO2.0 PLUS 有此功能)
继电器控制	CBIT128	<ul style="list-style-type: none"> 128 路继电器控制信号, 提供 5V/2A, 12V/500mA 继电器电源及$\pm 15V/500mA$ 模拟电源
交流源/表	ACSM PLUS	<ul style="list-style-type: none"> 4 通道输出, 16-Bit 200KHz 的 AWG, 16-Bit 200KSPS 及 12-Bit 10MSPS Digitizer
应用模块	PAM	<ul style="list-style-type: none"> 最小量程为$\pm 1nA$ 的 pA 级微小电流专用测量模块
	PFM	<ul style="list-style-type: none"> 量程分别为 1pF/10pF/100pF 的 pF 级微小电容专用测量模块
	OP-AMP Test Kit	<ul style="list-style-type: none"> 运算放大器及比较器专用测试套件, 最大支持四组运放或比较器测试
	HCM100	<ul style="list-style-type: none"> 20v/100A 大功率脉冲模块
	IPM Test Kit 2.0	<ul style="list-style-type: none"> IPM 测试头, 以及 DC+AC 测试资源, DC 达到 100A, AC 达到 200A 测试能力
	FET Test Kit	<ul style="list-style-type: none"> 基于 8200 资源, 提供标准 MOSFET 测试, 以及 GaN FET 测试, 并可以扩展测试动态 Ron

注:

- 产品规格以实物为准, 若有任何变更恕不另行通知。
- 图片仅供参考, 图例为 EX 测试盒。

